

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 2 月 16 日 (2017.2.16)

【公開番号】特開 2017-4010 (P2017-4010A)

【公開日】平成 29 年 1 月 5 日 (2017.1.5)

【年通号数】公開・登録公報 2017-001

【出願番号】特願 2016-176304 (P2016-176304)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/30 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 5/30

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 1 月 16 日 (2017.1.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

それぞれ x 軸と y 軸とに対応するブロック軸と通過軸とを有する反射型偏光子であって

、
 空気に露出され、それ故ブリュースター角反射極小を呈する第 1 及び第 2 の相対する主表面であって、両主表面は x 軸と y 軸とにそれ自身垂直である z 軸に垂直に配置され、z 軸と y 軸とは y - z 面を形成する、第 1 及び第 2 の相対する主表面と、

両主表面間に配置され、それぞれ n_x 、 n_y 、及び n_z の x 軸、y 軸、及び z 軸に沿った屈折率差を呈する隣接ミクロ層の複数の対に配列されたミクロ層の積層体であって、 $n_x > n_y > 0 > n_z$ であり、該積層体は総数 N のミクロ層を有する、ミクロ層の積層体と、

を具備し、

数 N と屈折率差 n_x は、偏光子が x 軸に沿って偏光した法線入射光に対して高い反射率を有するように選択され、前記高い反射率は R_{blocknormal} と呼称され、R_{blocknormal} は少なくとも 80 % であり、

数 N と屈折率差 n_y は、偏光子が y 軸に沿って偏光した法線入射光に対して低い反射率を有するように選択され、前記低い反射率は R_{passnormal} と呼称され、R_{passnormal} は 25 % 以下であり、

R_{passinc} は、総数 N 及び屈折率差 n_y のミクロ層の積層体と、総数 N 及び y 軸に沿った屈折率差 0 のミクロ層の積層体との間の R_{passnormal} における差であり、

R_{blockinc} は、総数 N 及び屈折率差 n_x を有するミクロ層の積層体と、総数 N 及び y 軸に沿った屈折率差 $n_x - n_y$ を有するミクロ層の積層体との間の R_{blocknormal} における差であり、

数 N は R_{blockinc} が R_{passinc} の少なくとも半分であるように選択され、

R_{passnormal}、R_{passinc}、R_{blocknormal}、及び R_{blockinc} は全て同じ波長範囲にわたっての平均である、

反射型偏光子。

【請求項 2】

接着剤により前記偏光子に取り付けられた機械的に補強性の基板を更に含み、前記補強性の基板は光の拡散又はコリメーションをもたらす構造化表面を有する、請求項 1 に記載

の偏光子。

【請求項 3】

前記 R_{passnormal} が、前記主表面の組み合わされた法線入射反射率より少なくとも 2 % 大きい、請求項 1 に記載の偏光子。

【請求項 4】

前記マイクロ層の少なくとも一部がポリエチレンナフタレート又はそのコポリマーを含み、前記 N が 2.75 ~ 3.25 の範囲にある、請求項 1 に記載の偏光子。